

X線分析顕微鏡(XGT)

装置概要

内蔵のカメラで試料を観察し、任意の場所で元素($_{11}\text{Na}\sim_{92}\text{U}$)の定性・定量分析を行なうことができます。

弊社に設置したX線分析顕微鏡はφ 10 μm 、100 μm のX線ビーム絞りを搭載しており、微小部分分析およびマッピング分析が可能です。また、マッピング分析と同時にX線透過像を得ることもできます。

主な応用範囲

- ・プリント基板上の微小異物分析
- ・樹脂中異物の非破壊分析



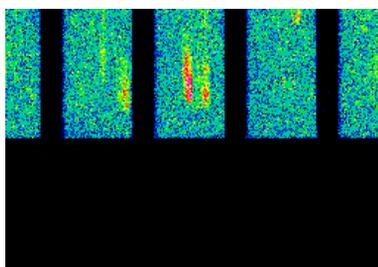
(株)堀場製作所製 X線分析顕微鏡 XGT 7200

SDカードのマッピング分析例

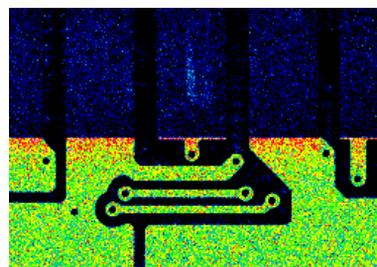
X線は試料を透過する性質を持つため、非破壊で樹脂やメッキの内部まで分析することが可能です。各種材料表面や樹脂中の異物分析に有効な方法といえます。



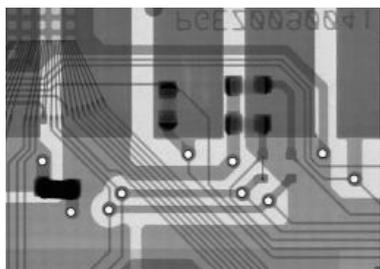
光学顕微鏡像



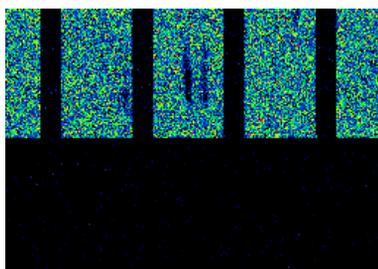
Ni 内層メッキ



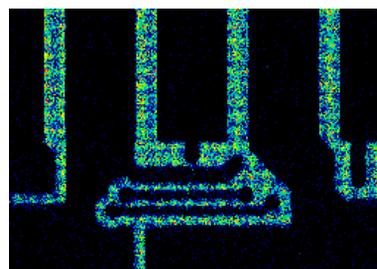
Cu 内層基板



X線透過像



Au 外層メッキ



Br 内層樹脂

川重テクノロジー株式会社

分析・環境評価

URL: <http://www.kawaju.co.jp>

お問い合わせは

明石 078-921-1663

神戸 078-682-5258

東京 03-3435-2485